ГУСТИНИ СТАНІВ НЕВПОРЯДКОВАНИХ МЕТАЛІВ У МЕТОДІ ТЕОРІЇ РОЗСІЯННЯ

П. М. Якібчук, О. В. Волков, С. О. Вакарчук

Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра фізики металів, вул. Кирила і Мефодія, 8, Львів, 79005, Україна

(Отримано 6 травня 2004 р.)

Запропоновано метод визначення густини станів, що базується на формалізмі *T*-матриці, згідно з яким густина станів електронів провідности виражається через арґумент конфіґураційно засередненої *T*-матриці розсіяння електронів на йонній підсистемі невпорядкованого металу. Для знаходження *T*-матриці розсіяння використано наближення слабкого зв'язку та розклад за парціяльними складовими. Парціяльні фазові зсуви розсіяння електрона на окремому йоні металу розраховано з використанням рівнянь Ліпмана-Швінґера для парціяльних складових розсіяної хвильової функції. Електрон-йонну взаємодію описано нелокальним модельним потенціялом, а структурний фактор невпорядкованого металу визначено в наближенні твердих сфер за моделлю Перкуса-Євіка.

Ключові слова: густина станів, фазові зсуви, модельний потенціял, псевдощилина.

PACS number(s): 43.38.Kw

вступ

Розрахунки електронних характеристик невпорядкованих металів пов'язані з низкою проблем. Поперше, через відсутність дальнього порядку в йонній підсистемі не можна використовувати методи трансляційної симетрії, що добре зарекомендували себе в зонній теорії кристалічних твердих тіл. По-друге, унаслідок відсутности чітких зон в енерґетичній структурі невпорядкованого металу залежність енерґії електрона провідности від хвильового вектора k не можна використовувати як характеристичну функцію такої системи [1]. Отже, енерґетична структура таких систем описується залежністю густини станів від енерґії N(E).

Як відзначено у праці [2], теорія збурень Бріллюена-Віґнера за псевдопотенціялом у третьому порядку добре описує властивості металів з низькими валентностями, але вже для металів з валентностями III або більшими існує лише якісна збіжність. У свою чергу варіяційні розрахунки густини станів сильно залежать від вибору пробних функцій. У цьому підході зроблено спробу отримати аналітичні вирази для визначення характеристик невпорядкованих систем, що мають загальніший характер порівняно з результатами теорії збурень Релея-Шрединґера та Бріллюена-Віґнера [3]. Проте ці методи є придатними для дослідження металічних систем без урахування квазізв'язаних (резонансних) станів, тобто без урахування особливостей електронної будови d- та f-перехідних металів.

Метою нашої роботи є розробка загальнішого методу розрахунку густини станів невпорядкованого металу, який був би позбавлений недоліків, властивих указаним методам.

Показавши, що метод *Т*-матриць Ллойда–Займана можна узагальнити на багатовузловий випадок, ми

отримали новий вираз для густини станів електронів провідности в невпорядкованому металі. При цьому використання *T*-матриці замість потенціялів електрон-йонної взаємодії дає змогу застосувати цей підхід до систем із резонансними потенціялами. Зауважмо, що в межах такого методу отримуємо пряму залежність густини станів від енергії електронів у зоні провідности і це дозволяє уникнути зонних розрахунків.

І. ГУСТИНА СТАНІВ ТА *Т*-МАТРИЦЯ РОЗСІЯННЯ НЕВПОРЯДКОВАНОГО МЕТАЛУ

Як відомо [4], густину станів електронів провідности в невпорядкованому металі можна зобразити через уявну частину повної функції Ґріна цієї системи, засередненої за всіма можливими конфіґураціями.

$$N(E) = -\frac{2}{\pi} \operatorname{Sp} \operatorname{Im} \langle G^{\pm}(E,k) \rangle_{\operatorname{conf}}.$$
 (1)

Зазначимо, що необхідність проведення засереднення за конфіґураціями зумовлена розупорядкованістю йонної підсистеми рідкого або ж аморфного металу [1].

Проінтеґрувавши за енергією вираз для густини електронних станів (1), визначимо кількість електронних станів у металі в діяпазоні енергій від 0 до E:

$$\aleph_E = \int_0^E N(E) \, dE. \tag{2}$$

Формально повну функцію Ґріна можна виразити че-

рез гамільтоніян системи \hat{H} , що описує взаємодію електрона провідности з просторово невпорядкованою системою йонів металу:

$$G^{\pm}(E,k) = (E - \hat{H})^{-1} = (E - \hat{H}_0 - \hat{W})^{-1},$$
 (3)

де \hat{H}_0 — вільноелектронний гамільтоніян, а $\hat{W}(\mathbf{r}) = \sum \hat{w}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)$ — потенціял електрон-йонної взаємодії в металі.

Урахувавши співвідношення (1)–(3), для
 \aleph_E одержуємо такий вираз:

$$\aleph_E = \frac{2}{\pi} \operatorname{Sp} \operatorname{Im} \operatorname{Ln} \left(E - \hat{H}_0 - \hat{W} \right) + \operatorname{const.}$$
(4)

Цей вираз можна розкласти на складові та визначити з нього густину станів

$$N(E) = \frac{d\aleph_E}{dE} = -\frac{2}{\pi} \operatorname{Sp} \operatorname{Im} G_0(E, k) + \frac{2}{\pi} \operatorname{Sp} \operatorname{Im} \frac{d}{dE} \operatorname{Ln} (1 - G_0(E, k) \hat{W}), \quad (5)$$

де $G_0(E,k) = (E - \hat{H}_0)^{-1}$ — вільноелектронна функція Ґріна.

З іншого боку, використавши рівняння Ліпмана– Швінґера [5] для хвильової функції розсіяної частинки на потенціялі W

$$\varphi_k^{(+)}(\mathbf{r}) = \phi_k(\mathbf{r}) + G_0(E)\hat{W}(r)\varphi_k^{(+)}(\mathbf{r})$$
(6)

та співвідношення для амплітуди розсіяння електрона

$$f(\theta) = -\frac{\left(2\pi\right)^{3}}{4\pi} \left(\frac{2m}{\hbar^{2}}\right) \left\langle \phi_{k'} \left| \hat{W} \right| \varphi_{k}^{(+)} \right\rangle$$
$$= -\frac{\left(2\pi\right)^{3}}{4\pi} \left(\frac{2m}{\hbar^{2}}\right) \left\langle \phi_{k'} \left| \hat{T}(E) \right| \phi_{k} \right\rangle, \tag{7}$$

можна записати інтеґральне рівняння, що пов'язує між собою T-матрицю розсіяння та потенціял, на якому воно відбувається:

$$\hat{T} = \hat{W} + \hat{W}G_0\hat{T}.$$
(8)

У виразах (6) та (7) $\phi_k(\mathbf{r})$ — хвильова функція падаючої частинки, а $\varphi_k^{\pm}(\mathbf{r})$ — хвильова функція розсіяння.

Зауважимо, що, згідно з виразом (1.8), $1 - \hat{W}G_0 = \hat{W}\hat{T}^{-1}$. Тому з рівняння (5) знаходимо

$$N(E) = N_0(E) - \frac{2}{\pi} \operatorname{Sp} \frac{d}{dE} \operatorname{Im} \langle \operatorname{Ln} \hat{T}(E) \rangle_{\operatorname{conf}}, \qquad (9)$$

де $N_0(E)$ — густина станів вільних електронів.

На підставі рівняння Дайсона для функції Ґріна та розкладі *Т*-матриці в ряд за потенціялом можна показати, що існує можливість перенесення конфіґураційного усереднення під логарифм. Отже, з (9) для густини станів отримаємо

$$N(E) = N_0(E) - \frac{2}{\pi} \operatorname{Sp} \frac{d}{dE} \operatorname{Im} \operatorname{Ln} \langle \hat{T}(E) \rangle_{\operatorname{conf}}, \qquad (10)$$

Оскільки уявною частиною логарифма комплексного числа є арґумет цього числа, то:

$$N(E) = N_0(E) - \frac{2}{\pi} \operatorname{Sp} \frac{d}{dE} \operatorname{Arg} \langle \hat{T}(E) \rangle_{\operatorname{conf}}.$$
 (11)

Розсіяння електрона провідности на невпорядкованій підсистемі йонів металу аналогічне до розглянутого в теорії розсіяння процесу розсіяння окремої частинки на мішені з багатьох частинок, які якісно відрізняються від розсіяної частинки. Унаслідок малости співвідношення мас електрона та йонів ефектами віддачі можна знехтувати, а малість кінетичної енерґії електронів провідности (порівняно з енерґією йонізації) дозволяє використовувати імпульсне наближення, тобто вважати процес розсіяння пружним [6].

Відомо [5], що *Т*-матриця розсіяння частинки на багаточастинковій мішені має вигляд:

$$\hat{T}(E) = \sum_{i} \hat{T}_{i}(E)\hat{\Omega}_{i}(E), \qquad (12)$$

де $\hat{T}_i(E) - T$ -матриця розсіяння електрона на окремому йоні металу, а $\hat{\Omega}_i(E)$ — оператор, що визначає внесок *i*-ого центра в процес розсіяння. Він визначається з такого рівняння [6]:

$$\hat{\Omega}_i(E) = 1 + \hat{G}_0(E) \sum_{i \neq j} \hat{T}_j(E) \hat{\Omega}_j(E).$$
 (13)

Якщо врахувати, що $\hat{W}(\mathbf{r}) = \sum \hat{w}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)$, то рівняння (12) та (13) отримуються з інтеґрального рівняння для *T*-матриці (8). Такий запис *T*-матриці розсіяння враховує й багаторазове розсіяння, проте у випадку невпорядкованих систем з малим (щодо довжини хвилі розсіяного електрона) кореляційним радіусом можна застосувати наближення слабкого зв'язку і знехтувати багаторазовим розсіянням. У цьому наближенні *T*-матрицю невпорядкованого металу можна записати так:

$$\hat{T}(E) = \sum_{j} \hat{T}_{\text{single}}(E) \delta^3(\mathbf{r}_j), \qquad (14)$$

де $\hat{T}_{\text{single}}(E) - T$ -матриця окремого йона. Отже T-матрицю розсіяння системи можна знайти зі співвідношення (14), якщо відомі T-матриці розсіяння окремих йонів металу та просторовий розподіл йонів у невпорядкованому металі.

Зауважимо, що арґумет *T*-матриці можна записати так:

$$\operatorname{Arg} \langle \hat{T}(E) \rangle_{\operatorname{conf}} = \operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{Im} \langle \hat{T}(E) \rangle_{\operatorname{conf}}}{Re \langle \hat{T}(E) \rangle_{\operatorname{conf}}} \right) + \pi N. \quad (15)$$

Оскільки T-матриця не залежить від
 ${\bf r},$ а є лише функцією енерґії, то

$$\langle \hat{T}(E) \rangle_{\text{conf}} \to C(k) \times \{ \langle \mathbf{k} + \mathbf{q} | T(E) | \mathbf{k} \rangle_{\text{conf}} \}_{\text{ang}}, \quad (16)$$

де C(k) — дійсна величина, ang означає засереднення за кутовими координатами, а conf — конфіґураційне

засереднення.

Об'єднавши вирази (14)–(16) та ввівши позначення:

$$\rho_q = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_i e^{i\mathbf{qr_i}}$$

отримаємо:

$$\operatorname{Arg} \langle \hat{T}(E) \rangle_{\operatorname{conf}} = \operatorname{Im} \operatorname{Ln} \langle \hat{T}(E) \rangle_{\operatorname{conf}}$$
$$= \operatorname{Im} \operatorname{Ln} \left\{ \rho_q \langle \mathbf{k} + \mathbf{q} | T_{\operatorname{single}}(E) | \mathbf{k} \rangle \right\}_{\operatorname{ang}}.$$
(17)

Оскільки ймовірність існування всіх дозволених просторових конфіґурацій йонної підсистеми є однаковою, то:

$$\operatorname{Arg}\langle \hat{T}(E)\rangle_{\operatorname{conf}} = \frac{1}{2}\operatorname{Im}\left(\operatorname{Ln}\rho_q\langle \mathbf{k} + \mathbf{q} | T_{\operatorname{single}}(E) | \mathbf{k}\rangle\right) + \operatorname{Ln}\rho_{-q}\langle \mathbf{k} + \mathbf{q} | T_{\operatorname{single}}(E) | \mathbf{k}\rangle\right) = \frac{1}{2}\operatorname{Im}\operatorname{Ln}S_q\langle \mathbf{k} + \mathbf{q} | T_{\operatorname{single}}(E) | \mathbf{k}\rangle^2,$$
(18)

де $S_q = \langle \rho_q \rho_{-q} \rangle_{\text{conf}}$ — структурний фактор невпорядкованого металу [7].

Ураховуючи, що потенціял електрон-йонної взаємодії є центрально-симетричним, для знаходження *Т*матриці розсіяння окремого йона використаємо розклад хвильової функції за парціяльними хвилями [6]. Тоді

$$\langle \mathbf{k} + \mathbf{q} | T_{\text{single}}(E) | \mathbf{k} \rangle = \frac{4\pi}{V_0 \sqrt{2E}} \sum_l (2l+1) e^{i\delta_l(E)} \sin \delta_l(E) P_l(\cos \theta), \tag{19}$$

де V_0 — атомний об'єм металу, $\delta_l(E)$ — парціяльний фазовий зсув, а θ — кут між векторами k та k+q.

З парціяльного розкладу рівняння Ліпмана–Швінґера [5] отримаємо інтеґральне рівняння для парціяльних радіяльних складових хвильової функції розсіяного електрона:

$$R_{l}^{(+)}(\kappa,r) = j_{l}(\kappa r) + 2\kappa n_{l}(\kappa r) \int_{0}^{r} j_{l}(\kappa r') w_{l}(r') R_{l}^{(+)}(\kappa,r') r'^{2} dr' + 2\kappa j_{l}(\kappa r) \int_{r}^{\infty} n_{l}(\kappa r') w_{l}(r') R_{l}^{(+)}(\kappa,r') r'^{2} dr', \quad (20)$$

де $w_l(r')$ — парціяльна складова потенціялу електрон-йонної взаємодії окремого йона, а $\kappa = \sqrt{2E}$.

Беручи до уваги асимптотичний розв'язок рівняння (16) пр
и $r \to \infty,$

....

$$R_l^{(+)}(\kappa, r \to \infty) = j_l(\kappa r) - \operatorname{tg} \delta_l(\kappa) n_l(\kappa r),$$

й умову зшиття асимптотичного та внутрішнього розв'язків поблизу радіуса дії потенціялу,

$$\frac{\partial R_l^{(+)}(\kappa, r \to \infty)}{R_l^{(+)}(\kappa, r \to \infty)\partial r} = \frac{\partial [j_l(\kappa r) - \operatorname{tg} \delta_l(\kappa) n_l(\kappa r)]}{[j_l(\kappa r) - \operatorname{tg} \delta_l(\kappa) n_l(\kappa r)]\partial r}\Big|_{r \to \infty},$$

фазовий зсув можна записати так [6]:

$$\delta_l(\kappa) = \operatorname{arctg}\left(\frac{j_l(\kappa R_{\operatorname{core}}) - R_l^{(+)}(R_{\operatorname{core}})}{n_l(\kappa R_{\operatorname{core}})}\right),\tag{21}$$

де $R_{\rm core}$ — радіус дії потенціялу.

Отже, розв'язавши рівняння (20), можна, згідно з (21), знайти парціяльні фазові зсуви та побудувати *Т*матрицю розсіяння окремого йона (19).

Узагальнюючи попередні вирази для визначення функції розподілу густини станів невпорядкованого металу в межах теорії розсіяння, об'єднаймо співвідношення (8), (18) та (19). Тоді, враховуючи вираз для вільноелектронного наближення густини станів $N_0(E) = V_0 \sqrt{2E}/\pi^2$, одержимо:

$$N(E) = \frac{V_0 \sqrt{2E}}{\pi^2} - \frac{1}{\pi} \frac{d}{dE} \operatorname{arctg} \left[\frac{\left\{ S_q \left[\operatorname{Re} T(E,q)^2 - \operatorname{Im} T(E,q)^2 \right] \right\}_{\theta}}{\left\{ 2S_q \operatorname{Im} T(E,q) \operatorname{Re} T(E,q) \right\}_{\theta}} \right],$$
(22)

де

$$\operatorname{Im} T(E,q) = \sum_{l} (2l+1)(2l+1)\sin 2\delta_{l}(\kappa)P_{l}(\cos\theta)|_{\kappa=\sqrt{2E}}$$
$$\operatorname{Re} T(E,q) = \sum_{l} (2l+1)(1-\cos 2\delta_{l}(\kappa))P_{l}(\cos\theta)|_{\kappa=\sqrt{2E}}.$$

Тут потрібно врахувати, що при пружному розсіянні на еквіпотенціяльній поверхні $|\mathbf{k} + \mathbf{q}| = |\mathbf{k}| = \kappa = \sqrt{2E}$, а $\cos \theta = 1 - q^2/2\kappa^2$ та $q \in [0, 2\kappa]$.

Потрібне значення енергії Фермі визначали з умови:

$$Z = \int_0^{E_F} N(E) \, dE,\tag{23}$$

тут Z — валентність йона.

Густина заповнених електронами провідности станів при температур
іTвизначається:

$$N_T(E) = \frac{N(E)}{1 + e^{\frac{E - E_F}{k_B T}}}.$$
 (24)

Потрібний для розрахунків потенціял електронйонної взаємодії будемо апроксимувати нелокальним модельним потенціялом (МП)[8]:

$$w^{(0)}(r) = -\frac{Z}{r} + \sum_{l} e^{-\frac{r}{R_l}} \left(\frac{Z}{r} + A_l\right) P_l,$$
 (25)

тут $A_l,\,R_l$ — параметри МП,
а P_l — проєкційний оператор.

У [8] наведено вираз для екранованого формфактора такого МП, який ураховує нелокальність електронйонної взаємодії.

$$w(q) = -\frac{4\pi Z}{q^2 V_0 \epsilon^*(q)} + f(k,q)$$
$$-\left(1 - \frac{\varphi(q)}{\epsilon^*(q)}\right) \frac{4}{\pi q^3 \epsilon(q)} \int_0^{k_F} f(k,q) \ln\left|\frac{k - 2q}{k + 2q}\right| k \, dk. \tag{26}$$

Тут уведено позначення:

$$\begin{split} f(k,q) &= \frac{4\pi}{V_0} \sum_{l=0}^{l_0} (2l+1) P_l(\cos\theta) \\ &\times \int_0^\infty e^{-\frac{r}{R_l}} \left(\frac{Z}{r} + A_l\right) j_l(kr) j_l(|\mathbf{k} + \mathbf{q}| r) r^2 \, dr, \\ \epsilon(q)^* &= 1 - (1 - \varphi(q))(\epsilon(q) - 1), \end{split}$$

де $\varphi(q)$ — поправка на локальне поле, а $\epsilon(q)$ — діелектрична проникність металу.

Отриманий унаслідок нелокальности формфактор має вигляд

$$w(k,q) = \int_0^\infty K(\mathbf{k}, \mathbf{k} + \mathbf{q}, r) W(r) \, d\,\mathbf{r},$$

де $K(\mathbf{k}, \mathbf{k} + \mathbf{q}, r)$ — ядро інтеґрального перетворення (слід зауважити, що через наявність у потенціялі проєкційного оператора інтеґральне перетворення не буде перетворенням Фур'є).

Потенціял електрон-йонної взаємодії знаходять з формфактора зворотним інтеґральним перетворенням. Екранований потенціял доцільно записати у вигляді

$$w(r) = w^{(0)}(r) + w^{\text{screen}}(r),$$

де $w^{\text{screen}}(r)$ — екрануюча складова.

У такому разі екрануючим внеском у формфактор з (26) буде:

$$w^{\text{screen}}(q) = \frac{4\pi Z(\epsilon^*(q) - 1)}{q^2 V_0 \epsilon^*(q)} - \left(1 - \frac{\varphi(q)}{\epsilon^*(q)}\right)$$

$$\times \frac{4}{\pi q^3 \epsilon(q)} \int_0^{k_F} f(k,q) \ln \left| \frac{k-2q}{k+2q} \right| k \, dk. \tag{27}$$

Очевидно, що екрануюча складова формфактора має локальний характер (немає залежности від k), тому для знаходження $w^{\text{screen}}(r)$ можна використати звортне фур'є-перетворення.

Розрахувавши екрануючу складову формфактора МП, отримаємо потрібний нам вираз для парціяльних складових екранованого потенціялу електрон-йонної взаємодії в металі, що використовується при розрахунку парціяльних фаз розсіяння згідно з (20):

wight b метал, що bindepictoby ty парціяльних фаз розсіяння згід $w_l(r) = -\frac{Z}{r} + e^{-\frac{r}{R_l}} \left(\frac{Z}{r} + A_l\right)$

$$+ \frac{V_0}{2\pi^2} \int_0^\infty w^{\text{screen}}(q) q^2 \frac{\sin(qr)}{qr} \, dq.$$
 (28)

II. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Розраховані за формулами (22)–(24) густини заповнених станів $N_T(E)$ при температурах, близьких до температур плавлення, для низки металів наведено на рис. 1. Суцільна лінія відповідає на графіках розрахункові за теорією розсіяння, штрихова — вільно-електронному наближенню.



Рис. 1. Густини станів невпорядкованих металів.

Для опису структури невпорядкованого металу використано теоретичні структурні фактори моделі твердих сфер Ашкрофта–Лекнера, значення параметрів упакування якого наведено разом з параметрами модельного потенціялу в таблиці 1. Обміннокореляційні ефекти враховано за допомогою поправки на локальне поле, взятої в наближенні Гелдарта– Воско. Згідно з [4], одновалентні метали групи IA мають найпростішу зонну структуру, й електронні характеристики таких металів задовільно описуються в межах вільноелектронного наближення (графіки залежностей $N_T(E)$ для цих металів не наведені). Вільноелектронний характер залежности густини станів від енергії зумовлений особливостями просторового розподілу йонної підсистеми таких металів. У кристалічному стані сфера Фермі таких металів лежить усередині першої зони Бріллюена, внаслідок чого ефекти, пов'язані з перекриттям різних зон, не спостерігаються. У невпорядкованому стані бачимо подібну картину. Тут визначальну роль в утворенні псевдощілини відіграють положення першого максимуму структурного фактора та положення точки перетину ефективною фазою значень, кратних π , тобто положення псевдозв'язаного стану [9]. В одновалентних металах перший пік структурного фактора S(q) перебуває в точці $q_{\rm max} > 2k_{\rm F}$, що приводить до розміщення псевдощілини далеко поза сферою Фермі і значного зменшення її величини.

Метал	η	A_0	A_1	A_2	R_0	R_1	R_2
Mg	0.45	3.982	5.086		0.608	0.485	
Al	0.45	7.025	9.5		0.514	0.404	
Zn	0.45	5.262	7.7106	6.1973	0.4622	0.3233	0.3872
Cd	0.45	4.714	6.4759	4.4018	0.516	0.3835	0.5444
In	0.45	6.940	8.2521	6.6431	0.522	0.4458	0.5444
Pb	0.45	8.878	9.1264	5.0671	0.588	0.5252	0.8968
Sn	0.45	9.485	10.625	9.4969	0.506	0.4582	0.5078

Таблиця 1. Щільність упакування η та параметри МП.

У двовалентних металах груп IIA та IIB максимум структурного фактора розташований у точці $q_{\max} \simeq 2k_{\rm F}$, що зумовлює наявність псевдощілини на кривій густини станів поблизу енергії Фермі.

Для металів груп IIIA та IVA пік структурного фактора перебуває в точці $q_{\rm max} < 2k_{\rm F}$. Тому псевдощілина є ближче до 0 енерґії, ніж у ІІ-валентних металах. Це можна пояснити аналогічно до попередніх випадків.

III. ВИСНОВКИ

Якісний аналіз одержаних результатів свідчить, що метод розрахунку густини станів у межах теорії розсіяння приводить до результатів, які дають змогу теоретично визначити енерґетичну структуру невпорядкованих неперехідних металів.

Варто зауважити, що, внаслідок використання апарату T-матриць, такий метод розрахунку густини станів можна легко поширити на перехідні метали, які характеризуються наявністю квазізв'язаних станів у зоні провідности. Подібний метод можна застосувати й до розрахунку аналогічних величин для рідких напівпровідників.

Двокомпонентні металічні сплави в межах цього методу вимагають інформацію про парціяльні структурні фактори, залишаючи саму процедуру повністю аналогічною до однокомпонентного випадку. Урахування динамічних властивостей йонної підсистеми та їхній вплив на енерґетичну структуру можна провести за допомогою динамічних структурних факторів.

Наведеним узагальненням розглянутої теорії та з'ясуванню проблем, пов'язаних з цим, будуть присвячені наступні роботи.

- [1] О. Маделунг, *Теория твёрдого тела* (Наука, Москва, 1980).
- [2] Н. Мотт, Электроны в неупорядоченых структурах (Мир, Москва, 1969).
- [3] С. А. Вакарчук, П. Н. Якибчук, Укр. физ. журн. 29,1272 (1984).
- [4] Дж. Займан, Принципы теории твёрдого тела (Мир, Москва, 1974).
- [5] С. Сунакава, Квантовая теория рассеяния (Мир, Мос-

ква, 1979).

- [6] K. M. Goldberg, J. T. Watson, *Collision theory* (John Willey and Sons Inc, New York, 1963).
- [7] N. W. Ashcroft, J. Lekner, Phys. Rev. Lett. 145, 83 (1965).
- [8] С. А. Вакарчук, П. Н. Якибчук, В. В. Фурман, Физ. многочастичных систем 15, 27 (1989).
- [9] Л. И. Ястребов, А. А. Кацнельсон, Основы одноэлектронной теории твёрдого тела (Наука, Москва, 1984).

П. М. ЯКІБЧУК, О. В. ВОЛКОВ, С. О. ВАКАРЧУК

DENSITY OF STATES OF DISORDERED METALS WITHIN SCATTERING THEORY

P. M. Yakibchuk, O. V. Volkov, S. O. Vakarchuk

Ivan Franko National University of Lviv, Department for Physics of Metals, 8 Kyrylo i Mefodii St., Lviv, UA-79005, Ukraine E-mail: wwwolch@icqmail.com

Here we present the method based on formal solutions of T-matrix scattering theory. Within this approach the density of states can be presented as some function of T-matrix that describes the scattering processes of electron in the conduction band of disordered metal averaged over configuration. We use weak bond approximation and partial wave approach to get T-matrix. We get partial phase shifts from the partial mode of the Lippmann–Schwinger equation for scattered wave function where electron–ion interaction is described by a non-local model potential and we use the Percus–Yevick hard sphere model for the structure factor.